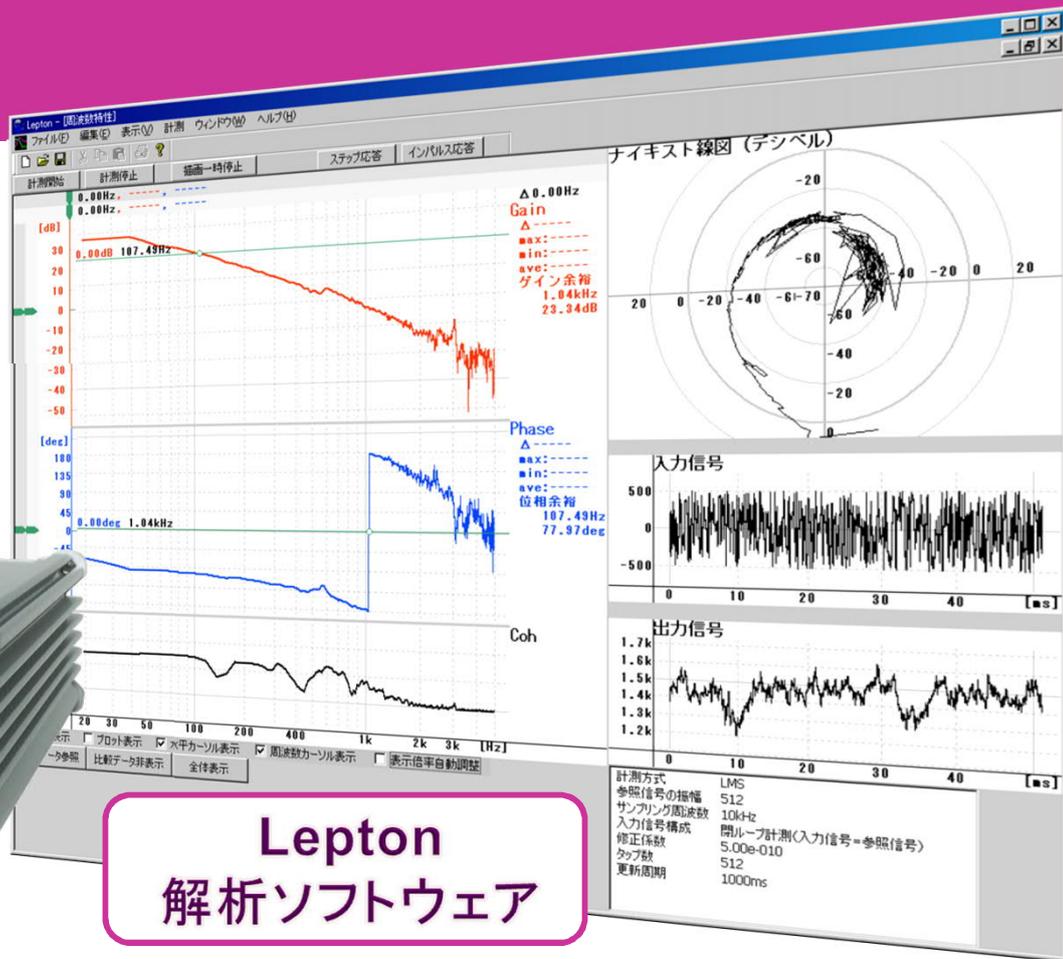


NEW quattro SYSTEM

さらに進化した
サーボアナライザー

quattro 2
計測器



高機能

計測I/Fに加えて制御I/Fを装備
計測対象を直接制御しながら計測可能

高速度

サンプリング周波数が向上（当社比6倍）
FRA、FFTモードともに計測周波数を向上

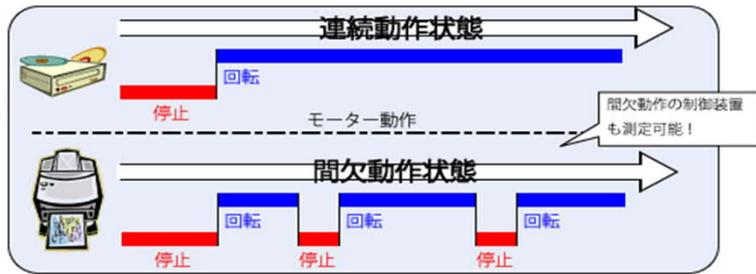
超小型

高さは単三電池以下のコンパクト設計

主な特長

止まってでも計測可能！

コントローラーのカスタマイズにより、間欠的に動作する制御系に対しても計測可能(業界初！)。



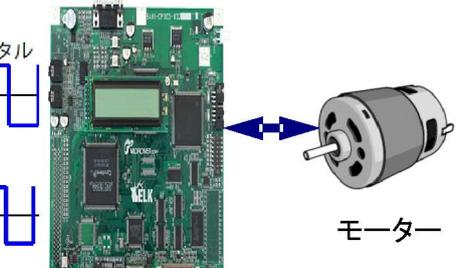
2つのデジタルI/F



デジタル計測 I/F

デジタル制御 I/F

ノイズの影響が無い
高精度計測！



製品仕様

項目		内容(quotto2)		
計測モード	サンプリング周波数	50kHz以下 *さらに高い周波数が必要な場合は、お問合せください		
	FFTモード (外乱ホワイトノイズ)	●間欠動作時の計測モード		
		外乱の振幅	0~1023	
		1セットあたりデータ数	8192ポイント以下	
		表示周波数(下限)	1/(サンプリング時間×データ数) *サンプリング時間=1/サンプリング周波数 *データ数が大きいほど下限の周波数は小さくなります	
		表示周波数(上限)	サンプリング周波数の1/2	
		平均回数	200回以下	
	FRAモード (正弦波)	●連続動作時の計測モード		
		正弦波の振幅	0~1023	
		計測範囲(下限)	1Hz	
計測範囲(上限)		サンプリング周波数の1/10		
分割設定		リニア等間隔/対数等間隔		
	計測ポイント	1000ポイント以下 *大きいほど計測時間が長くなります		
	平均回数	200回以下		
解析ソフトウェア (Lepton)	入出力波形	表示方法	縦軸: 電圧 リニア 横軸: 時間 リニア	
		表示可能な波形種別	・周波数特性計測用の外乱波形 ・計測対象との動作確認用のステップ関数波形 ・計測対象との動作確認用のインパルス関数波形	
	ボード線図	表示方法	縦軸: ゲインと位相 リニア 横軸: 周波数 リニア/ログ	
		解析機能	・ゲイン余裕、位相余裕を数値表示 ・入出力信号の線形性を現すコヒーレンス関数を表示 ・カーソル機能により波形読み取りが容易	
	ナイキスト線図	表示方法	縦軸: 虚数部の極座標表示 横軸: 実数部 動径: デシベル/絶対値	
	計測結果保存	CSVファイル Leptonデータファイル(独自フォーマット)		
PC動作環境	WindowsXP、Vista、7、8、8.1、10			
デジタル計測I/F	I/Fコネクタ(計測用)	10ピン	2.54ピッチ 5×2	
	I/Fコネクタ(制御用)	14ピン	2.54ピッチ 7×2 *通常は未使用です (計測対象を制御する際に使用します)	
	通信仕様	SPI準拠	通信クロック: 5MHz、データ幅: 8bit/16bit、送信: 1ch/受信: 1ch	
	電気的特性	CMOSロジック	3.3V 74LVCシリーズ、5V CMOS切り替え可	
PC接続I/F	USB	2・0		
電源	ACアダプタ	入力	AC100~240V、50/60Hz	
		出力	+5V	
	消費電力	5W以下		
本体	サイズ	H41×W76×D103		
	重量	約260g		
	動作温度	10~40°C(結露なきこと)		

お問い合わせ窓口

各種カスタマイズ、計測サービスのお見積りをいたします。

株式会社 マイクロネット 営業本部
〒210-0001 神奈川県川崎市川崎区本町2-8-14 本町矢田ビル
TEL:044-244-9406(代表) Email:inquiry@micronet.jp